

제품 안내

X-SOL 제품군	BASE	STANDARD	PRO
수동 검사 모드	○	○	○
검사 리뷰 모드	○	○	○
자동 검사 모드		○	○
검사 최적화 모드			○

검사 모듈	설명
VOID (기본 포함)	관심 영역을 지정하여 보이드, 크랙 등의 결함 검사
NGA (옵션)	관심 영역 내 비정형 솔더 영역을 탐지하여 결함 검사
GA (옵션)	패턴을 가진 솔더 영역을 인식하여 결함 검사

서비스 안내

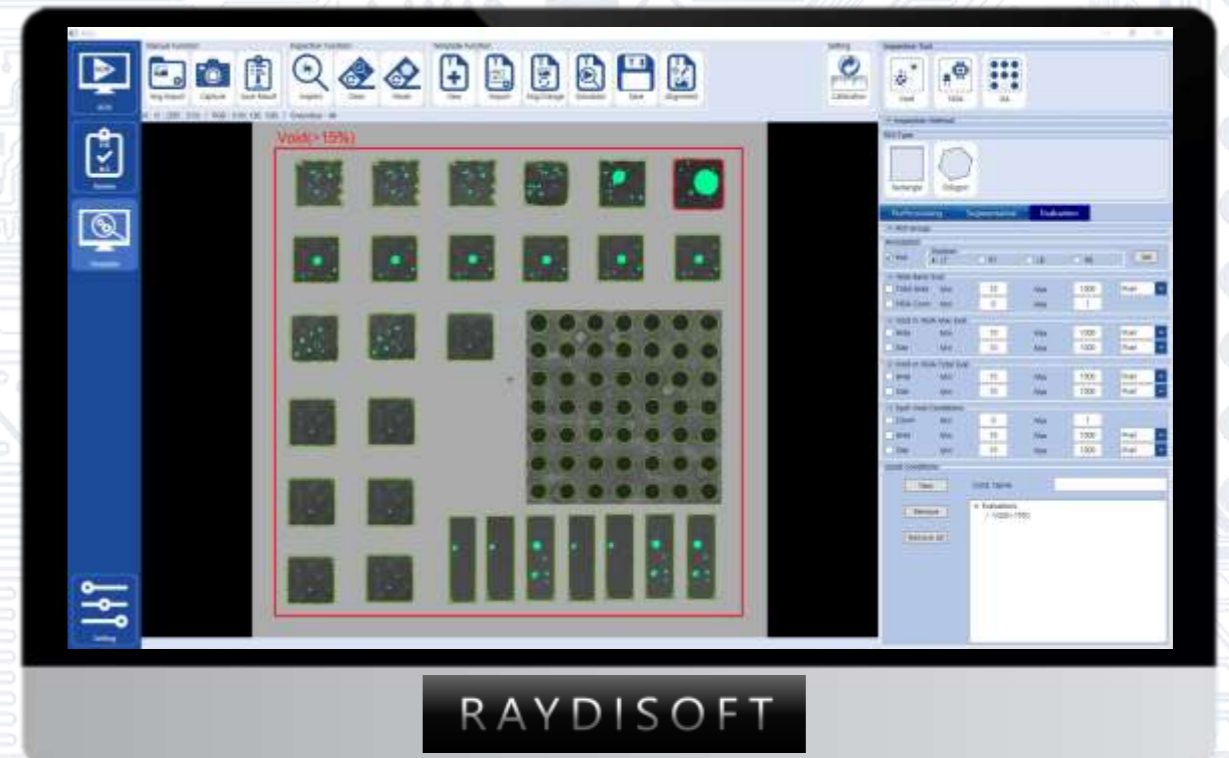
서비스 종류	설명
결함 분석 서비스	검사이미지의 결함을 분석하여 리뷰 출력 파일 제공
검사 템플릿 제작 서비스	매크로 자동 검사를 위한 검사 템플릿 제작
커스텀 리포트 서비스	패턴을 가진 솔더 영역을 인식하여 결함 검사
제품 교육	다양한 무상 및 유상 교육 기회 제공

우수한 성능, 합리적인 가격으로
귀사 검사 장비의 격을 높여 드립니다.

RAYDISOFT 레이디소프트(주)

E-Mail : info@raydisoft.com
Website : www.raydisoft.com

X-SOL 투과영상기반 산업용 부품 내부 검사 소프트웨어



제품 소개

X-SOL 제품은 X-ray 검사장비 등에서 촬영한 투과 영상 데이터를 이용하여 BGA, LED, QFN, Chip 등 전자부품 및 다양한 산업용 부품 내부 검사 목적으로 사용될 수 있는 비전검사 소프트웨어입니다.

제품 특징

- 검사 장비 교체없이 소프트웨어 설치 가능
- 실시간/오프라인/반복 자동 검사를 위한 매크로 검사 기능 지원
- 검사 결과를 쉽게 확인할 수 있는 검사 리뷰 기능 제공
- 복수의 논리연산 검사 조건 설정 가능
- 비정형 형상 및 복수 관심 영역 검사 가능

검사 항목

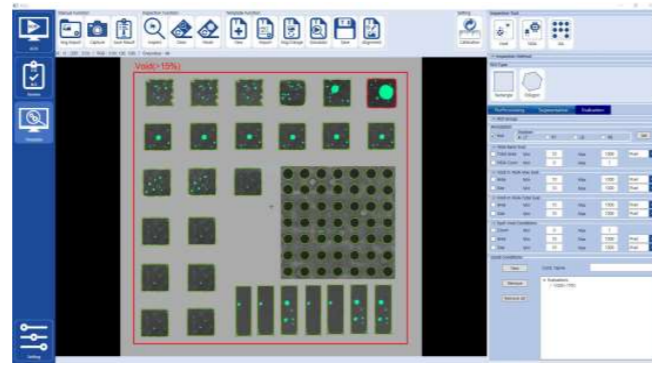
검사 대상	검사 항목
일반 부품	보이드, 크랙, 오염, 이물, 도포영역
BGA / Wafer Bump	브릿지(쇼트), 기공, 과납, 소납, 미싱 등
QFN / QFP / Chips	브릿지(쇼트), 기공, 과납, 소납, 미싱 등
LED	기공, 솔더볼, 도포영역

주요 기능

검사 템플릿 설정

레퍼런스 이미지 지정, 관심 영역과 파라미터 설정 및 검사 조건을 설정할 수 있습니다.

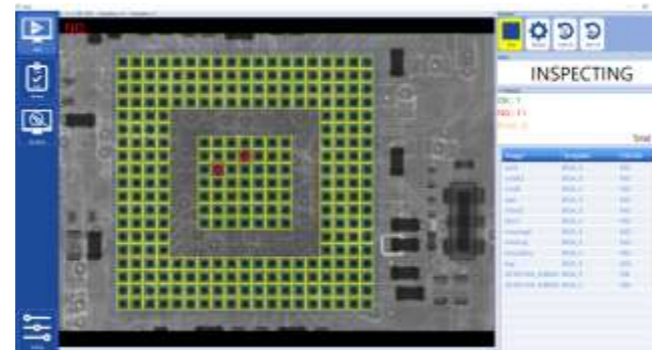
비정형 형상 및 복수의 관심 영역을 검사할 수 있는 도구들을 지원하며, 논리연산에 의한 결함 판정 및 등급별 결함 조건 설정이 가능합니다.



자동 검사

지정된 디렉토리에 존재하거나 새로 생성되는 검사 이미지를 자동으로 인식하고, 검사 템플릿에서 설정한 검사 조건으로 양불 여부를 자동으로 판정해줍니다.

오프라인 / 실시간 / 반복 자동 검사에서 유용하게 쓰일 수 있습니다.



검사 리뷰

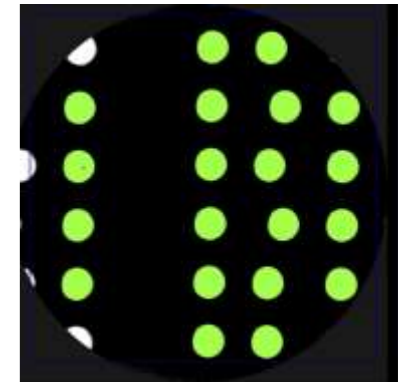
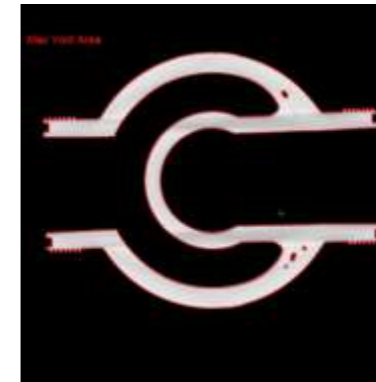
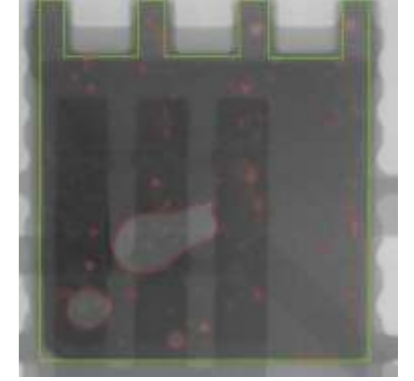
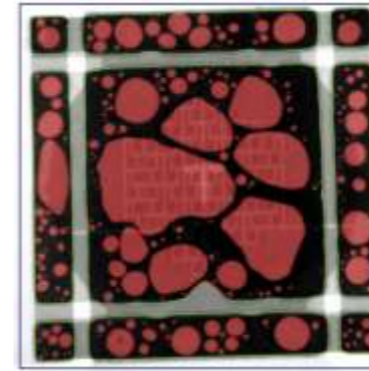
지정된 폴더의 검사 결과 파일을 불러 검사 이미지별 검사 결과 및 판정 원인 확인이 가능하며, 가성불량에 대해 결과를 교정할 수 있습니다.

다른 사용자와 검사결과를 공유하거나 최종 검수 목적으로 유용하게 쓰일 수 있습니다.



적용 예시

NGA 검사 모듈 (보이드 / 비정형 오브젝트 면적 / 카운트 / CT 단면 검사 등)



GA 검사 모듈 (보이드 / 쇼트 / 위치이탈 / 솔더면적 검사 등)

